

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

應變矽奈米 CMOS 元件的熱載子
可靠性研究與分析

**Investigation of Hot Carrier Reliabilities in
Strained-Silicon Nanoscale CMOS Devices**

研究生：劉又仁

指導教授：莊紹勳 博士

中華民國九十四年七月

應變矽奈米 CMOS 元件的熱載子
可靠性研究與分析

**Investigation of Hot Carrier Reliabilities in
Strained-Silicon Nanoscale CMOS Devices**

研 究 生：劉又仁

Student : You-Ren Liu

指導教授：莊紹勳 博士

Advisor : Dr. Steve S. Chung

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班



A Thesis

Submitted to Department of Electronics Engineering & Institute of
Electronics College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Electronics Engineering

July 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China.

中華民國 九十四 年 七 月